

京都大学大学院エネルギー科学研究科  
国際先端エネルギー科学研究教育センター共同利用設備の利用に関する要項  
(令和4年7月1日センター長裁定制定)

(趣旨)

第1条 この要項は、国際先端エネルギー科学研究教育センター(以下「センター」という。)の共同利用スペースに設置する共同利用設備群(以下「センター共同利用設備」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 センター共同利用設備は、別表に掲げる設備とする。

(利用者の資格)

第3条 センター共同利用設備を利用できる者は、次の各号に該当するものとする。

- (1) 本学の教職員
- (2) 本学の学生
- (3) その他センター長が認めた者

(管理責任者)

第4条 センター共同利用設備の適正な利用および管理を図るため、管理責任者を置き、センター長をもって当てる。

(機器責任者)

第5条 センター共同利用設備の適正な利用を図るため、各設備に機器責任者を置き、センター長が指名する。

(利用申請)

第6条 センター共同利用設備の利用を希望する者は、本要項の定めるところに従い、京都大学大学院エネルギー科学研究科国際先端エネルギー科学研究教育センター共同利用設備利用申込書(様式1)(以下「申込書」という。)を提出し、管理責任者の許可を得なければならない。

- 2 申込書は、利用を開始しようとする日の6ヶ月前から10日前までに、センター事務担当(エネルギー科学研究科総務掛)に提出しなければならない。
- 3 利用期間満了後に継続して利用を希望する場合は、利用期間満了の10日前までに申込書をセンター事務担当に提出すること。

(利用者の厳守事項)

第7条 利用者は、センター共同利用設備の利用に関し、管理責任者によって定められた各設備の使用上の詳細な規則(以下「使用規則」という。)ならびに本要項に掲げる事項を遵守しなければならない。

- 2 利用者は、操作手順の教育および単独操作に関し、使用規則に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 3 利用者は、センター共同利用設備を利用の都度、利用に関する情報を使用記録簿等に記載しなければならない。
- 4 利用者は、機器の異常に気づいたときは速やかに機器責任者に届け出て、その指示に従

わなければならない。

(利用の停止)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、センター共同利用設備の利用許可を取り消し、もしくは利用を停止させることができる。

- (1) 利用者が、本要項もしくは使用規則に違反し、または違反する恐れがあると管理責任者が認める場合
- (2) 利用申請などの利用前情報に虚偽があった場合
- (3) 使用記録簿などの利用中および利用後情報に虚偽があった場合
- (4) センター共同利用設備の管理上の事由により、利用に支障があると管理責任者が認める場合

(原状回復)

第9条 利用者が利用を終了した際は、利用したセンター共同利用設備を速やかに原状回復するとともに、機器責任者の検査・確認を受けなければならない。ただし、機器責任者が不要と認めた際は、この限りではない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責に帰すべき事由によりセンターの機器、施設等に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、センター共同利用設備に関し必要な事項はセンター長が定める。

附 則

この要項は、令和4年7月1日から施行する。

## 別表 センター共同利用設備一覧

(令和6年4月1日現在)

装置番号	装置名・型番	機器責任者
B001-01	Matrix assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) AXIMA Performance, SHIMADZU	河本 晴雄 教授
B002-01	X-ray diffractometer (XRD) X'Part PRO, PANalytical	三宅 正男 教授
B002-02	X-ray diffractometer (XRD) X'Part PRO, PANalytical	土井 俊哉 教授
B002-04	Transmission electron microscope (TEM) JEM-2010, JEOL	奥村 英之 准教授
B002-05	X-ray absorption fine structure (XAFS) R-EXAFS 2000-T/F, Rigaku	高井 茂臣 准教授
B002-06	X-ray photoelectron spectrometer (XPS) JPS-9030, JEOL	三宅 正男 教授
B002-07	Chemisorption analyzer AutoChem II 2920, SHIMADZU	小川 敬也 准教授
B002-08	Scanning probe microscope (SPM) SPM-8100FM, SHIMADZU	河本 晴雄 教授
B002-09	Zeta-potential & particle size analyzer ELSZ2000ZS	蜂谷 寛 准教授
B002-10	Circular dichroism spectrometer (CD) J-1500	岡崎 豊 助教
B003-01	Laser microscope VK-9700, KEYENCE	安部 正高 准教授
B003-02	Scanning electron microscopy (SEM) VE-9800, KEYENCE	安部 正高 准教授
B003-03	Precision universal / Tensile tester AG-100kNX, SHIMADZU	安部 正高 准教授
B003-04	Hardness tester DUH-211S, SHIMADZU	安部 正高 准教授
B003-05	Hardness tester HMV-2TADW, SHIMADZU	安部 正高 准教授
B003-06	Field emission scanning electron microscope (FE-SEM) SU6600, Hitachi High-Tech with EDX (XFlash 5010, Bruker) and EBSD (C-Nano+, Oxford Instruments)	藪塚 武史 講師
AESL-01	模擬電力系統実験設備 Lab-scale simulated power system equipment	川山 巖 准教授
AESL-02	3T-MRI システム (直流電源設備を含む) 3T-MRI System (with DC power supply)	川山 巖 准教授

